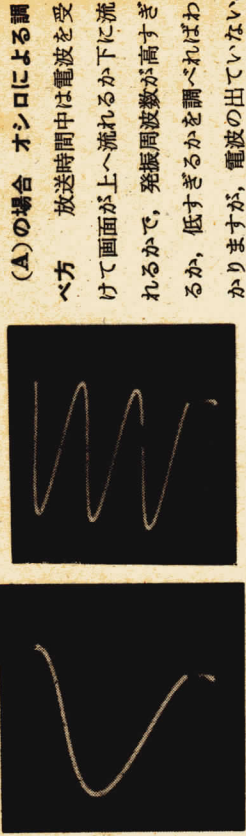


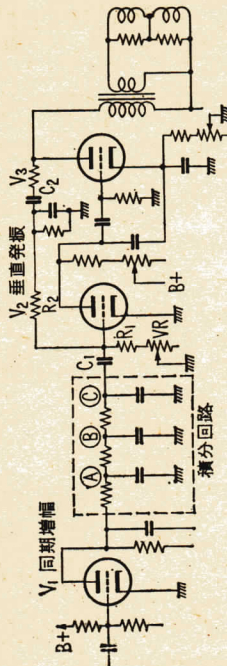
は上から下に流れてしまいます。なお発振トランスの一次二次間、および二次とアース間の絶縁抵抗の低下も発振周波数が高くなる原因になります。



49. 4 図 n = 1/3

口の垂直軸に発振トランスのB端子のところの信号を入れ、水平軸に低周波発振器の出力をつないで、オシロに現われるリサージュ波形が49.4図のようになれば、そのときの低周波発振器の発振周波数の読みがn倍が垂直発振周波数になりますから、低くなっているか、高くなっているかわかります。すなわち、受信機の同期調節用ポリウムを中心のところにしておいて、低周波発振器の周波数を60 c/sにし、49.4図のn=1になるように49.2図のR₁またはC₁を加減すればよいわけです。

電波の出ているときには、受信して49.3図の(b)のようにオシロを接続し、V₂のグリッド波形をみて同期信号と発振パルスの関係をみれば、発振周波数が高いか低いかかわかります。発振周波数の変化の傾向がわかれば、後はテストによって調べて下さい。



49. 5 図 垂直マルチバイブレータ発振回路

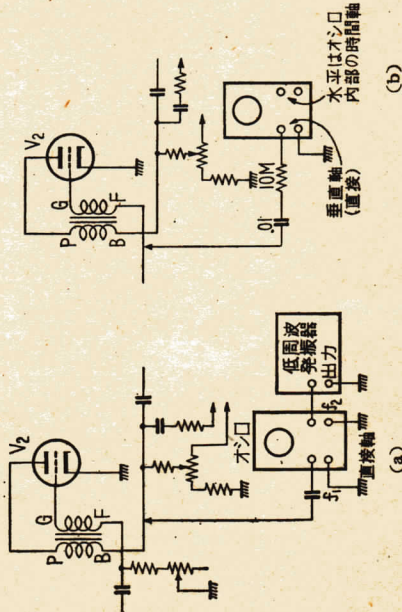
49.5図の回路の受信機では、まず真空管を良品と取り換えてみて、発振周波数を定める時定数C₁, R₁, VRの値の変化を調べればわかります。R₁およびVRはテストをオーム計にして、その値を測って規定と違っていれば、元の値になおします。C₁の場合は規定の容量のコンデンサに取り換えるか、並列に小さいコンデンサをつけてみるこ

(B)の場合 垂直同期の調節ポリウムを回すと、画は自由に上下に流れます。この場合は同期分離回路のどこかで同期信号が消滅しているのですが、水平同期は止まっていて、この症状を起こす場合は、水平同期と垂直同期とが別々になってから後の回路で起こっている故障ですから、その場合は積分回路(49.2図の点線の中)であるという推察はつきます。

(A)の場合 テスタによる調べ方 まず49.2図の真空管V₂のエミ減の有無を調べてみます。これはプレート回路にテストを電流計にしたものを入れて、流れる電流の値を調べてもよいのですが、真空管V₂を良品と取り換えてみるのが簡単で確実です。エミ減になってもよいければ、発振周波数は高めになります。次に、VRを含めたグリッドリークの値が変化していないかどうかを調べます。これはテストをオーム計にして調べればわかります。VRの中央端子の摺動が完全かどうか調べる必要があります。不完全のときは、発振周波数が低くなります。このR₁の抵抗は高抵抗なので変化して規準値より高くなりますから、発振周波数は低くなり、画が下から上に流れて停まらなくなるが多いです。

グリッドリークが完全であればC₁の絶縁抵抗を同じようにテストのオーム計で調べますが、これはテストでは相対的にC₁の絶縁抵抗が低下している場合にはわかりませんが、少しぐらいのものではわかりません。この場合はメガーを使って調べます。49.2図のようにC₁が発振周波数を定める時定数回路になっていると同時に、V₁のプレート直流電圧の阻止用になっている回路では、わずかの絶縁抵抗の低下も相当に発振周波数に影響します。

C₁の容量の変化を調べることはむずかしいので、新品と交換してみます。絶縁抵抗の低下、および容量変化(容量が少なくなる)のときは発振周波数は高目に振りますから、画面



49. 3 図 リサージュで発振周波数をしらべる。

